(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出題 PCF/TO 03 DEC 2004

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



1 CERTE TO THE REPORT OF THE PARTY OF THE PA

(43) 国際公開日 2003 年12 月11 日 (11.12.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/102476 A1

(51) 国際特許分類7:

.

. . .

D-2104 広島県 深安郡 神辺町 字道上 1588番地

(21) 国際出願番号:

PCT/JP03/07075

(22) 国際出願日:

2003 年6 月4 日 (04.06.2003)

F24F 7/06, H01L 21/02

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-163303 2002年6月4日(04.06.2002)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ローツェ株式会社 (RORZE CORPORATION) [JP/JP]; 〒

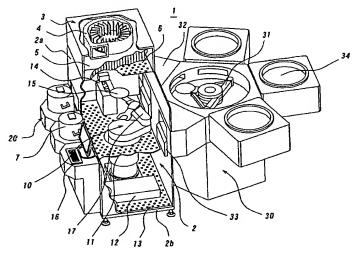
720-2104 広島県 深安郡 神辺町 字道上 1 5 8 8番地の 2 Hiroshima (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 崎谷 文雄 (SAKIYA,Fumio) [JP/JP]; 〒720-2104 広島県 深安郡 神辺町 字道上 1588番地の2 ローツェ株式会社 内 Hiroshima (JP).
- (74) 代理人: 杉村 興作 (SUGIMURA,Kosaku); 〒100-0013 東京都 千代田区 霞が関 3 丁目 2 番 4 号 霞山ビル ディング Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,

/続葉有/

(54) Title: SHEET-LIKE ELECTRONIC COMPONENT CLEAN TRANSFER DEVICE AND SHEET-LIKE ELECTRONIC PRODUCT MANUFACTURING SYSTEM

(54) 発明の名称: 薄板状電子部品クリーン移載装置および薄板状電子製品製造システム



(57) Abstract: A sheet-like electronic component clean transfer device, wherein a first floor (11) formed of punched plate and allowing air to flow thereto is installed in the casing (2a) of the clean transfer device (2) just under an arm (17) at the middle height part of a conveying robot (10), and when the degree of opening of a casing bottom part frame (2b) supporting the base part of the conveying robot (10) to the outside is limited, a class 1 can be maintained and when a second floor (13) formed of a punched plate is used on the casing bottom part frame (2b), the state of class 0 can be realized under specific conditions so that semiconductors with a wire width of 0.1 μ m can be manufactured, whereby the device can cope with the unexpectedly high degree of cleanliness of 0.1 μ m particle class 1 requested also for transfer devices according to a reduction in wire width on a highly integrated semiconductor wafer.

(57) 要約: クリーン移載装置(2)の筐体(2a)内の搬送ロボット(10)の中位部にてアーム(17)のすぐ下に、パンチング板等からなり空気の流通する第1の床(11)を設け、搬送ロボット(10)の基部を支持する筐体底部フレーム(2b)の、外部に対する開口度も制限すると、クラス1を保つ事ができ、ここで、筐体底部フレーム(2b)上にパンチング

VO 03/102476 A1

WO 03/102476 A1



DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

板等からなる第2の床(13)を用いると、特定の条件下ではクラス0状態を実現でき、0. 1μ m線幅の半導体製造が可能となった。これにより、高集積度半導体ウエハ上の線幅の微細化に伴って移載装置にも要求される従来にない高クリーン度0. 1μ m粒子クラス1に対応可能となった。

明 細 書

薄板状電子部品クリーン移載装置および薄板状電子製品製造システム

技術分野

本発明は、半導体ウエハ、液晶表示装置、プラズマ表示装置、有機及び無機エレクトロルミネッセンス、フィールドエミッティング表示装置、プリント配線基板などの製品および、それらに用いられる薄板状電子部品を、清浄環境下において、清浄容器であるカセットと各種処理装置間で移載する、クリーンブースを含む移載装置および、その移載装置を用いる薄板状電子部品の製造設備に関するものである。

背景技術

従来の清浄空間であるクリーンブースでは、例えば、特開平2-4145号公報に見られる様に、箱状体の天井に設置されたHEPA(High Efficiency Particulate Air)フィルタ、或いはULPA(Ultra Low Penetration Air)フィルタから供給される清浄空気が、異物を下方に吹き流して、多孔板からなるグレーチング床から外部に排出する方法が取られていた。しかして近年、粒状の異物や有機物などによる汚染を完全に排除する必要がある線幅1μm以下の半導体ウエハを代表とする薄板状電子部品の製造工程では、ミニエンバイロンメントと呼ばれる高度に清浄化されたクリーンブースが使用されるようになった。この一例として特開2001-24315号公報では、異物発生源である搬送ロボットの胴体に排気システムを設け、排気量をコンピュータ制御する装置が提案されているが、その定量的効果は記載されていない。

発塵の恐れがあるロボットを用いない場合、例えば、特開2000-1

61735公報記載の装置においては、 $0.3\mu m$ ダストでクラス10以下が達成されているが、線幅 $0.5\mu m$ 以下の半導体ウエハを取り扱う場合は、猶不充分である。また、前述の特開2001-244315号公報記載のものの場合は、クリーンブース内で異物発生源であるロボットや開閉するドアなどが動く場合や、薄板状物の裏側に発生する渦流に乗って異物が舞い上がる場合があって、清浄度が不充分であり、さらに、高価なコンピュータ制御システムを設置すると設備費の上昇を招き好ましくない。

発明の開示

本願発明者は、前記諸問題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、薄板状電子部品が、カセットや、処理チャンバ等ロードロック室等の所定場所間で、筐体天井に備えられたファンフィルタユニットを通過後の清浄空気下にて、筐体内の搬送ロボットにより自動的に移載される装置において、 0.1μ m以上の粒子を 99.99 %以上除去するフィルタをファンフィルタユニットに用い、搬送ロボットの中位部にてアームの下側に位置し空気の流通する床(以下「第1の床」という)を水平に設け、筐体でファンフィルタユニットとその第1の床との間に第1室を画成するとともに、外部に対し空気流通可能な筐体底部とその第1の床との間に第2室を画成することにより、運転中においても、 0.1μ m粒子に対しクラス1という極めて高度な清浄状態を維持できることを見出した。

本発明におけるファンフィルタユニットには、 0.1μ m以上、好ましくは 0.01μ m以上の粒状異物を99.999%以上、または 0.1μ m以上の粒状異物を99.999%以上排除できるULPAフィルタと、このULPAフィルタに空気を押し込む送風機とを備えた装置を使用でき、そのフィルタは、浮遊有機物を吸着除去するために活性炭や活性炭素繊維フィルタなどの吸着材を付与したケミカルフィルタであってもよい。

さらに、本発明におけるファンフィルタユニットには、ULPAフィルタのすぐ下にあって空気の流通する板状物からなる、第1室の天井となる部材を設けてもよい。この天井部材としては、グレーチング或いはパンチング板と言われる金属やプラスチック製の多孔板や、ルーバといわれる格子状体がある。

本願発明者は、前記第1の床の他に、搬送ロボットの基台付近に位置し空気の流通する第2の床を水平に配置して、外部に対する前記筐体底部の開口率を変化させると、さらに効果があることも見出し、これにより、ウエハ等の薄板状電子部品が移送される空間が極めて清浄化された移載装置を開発した。

本発明のクリーン移載装置では、筐体がファンフィルタユニットから清浄空気の吹出しを受ける前記第1の床の上側に画成する清浄空間(第1室)の壁に、薄板状電子部品を出し入れするドアを設けるが、本発明では好ましくは、その壁に設けたドア枠と閉時のドアの外辺との間に、各辺とも幅1mm以上30mm以下の隙間を設ける。同様に、好ましくは、ドアが開放された後の、設置されたカセットの外周と壁に設けたドア枠との間にも、4辺とも幅1mm以上30mm以下の隙間を設ける。また好ましくは、カセットがドア枠付近への設置のためにドア枠に向けて移動する間やドアが開閉する際もその幅1mm以上30mm以下の隙間を維持する。さらに、好ましくは、前記クリーン移載装置内に置かれるロボットの胴体と第1の床との間にも、幅1mm以上30mm以下の隙間を設ける。

なお、本発明のクリーン移載装置は、一般には外部に対し気密に処理チャンバに接続するが、前記カセット同様、幅1mm以上30mm以下の隙間をあけて処理チャンバに接続してもよい。

この隙間によって、薄板状電子部品が存在する空間の気圧変動を最小に抑え、気流の乱れを最少にして異物の舞い上がりを防止することができる。

隙間がないと、排風は空気の流通する第1の床の開口度のみに依存するので、第1室の内圧が高まって最大25Paにも達し、ドアが開くと内圧が一挙に1.3~2分の1に下がり、ドア周辺で急激な排気による気流の乱れが発生するのみならず、室内にある搬送ロボットのアームやウエハの周辺でも気流が乱れて渦流が発生することがあり、そこに異物を巻き込んだり、そこにある異物を排出できなくなったりする等の不具合が生ずる。隙間が1mm以下と狭いと前記のような大きな内圧差が解消されず、逆に隙間が大きすぎると外部から異物が拡散侵入しやすい。本願発明者は実験的、経験的に、その隙間は最大でも30mmが限界であることを見出した。

また、前記筐体内の前記第1の床の上側の第1室の気圧を、前記筐体内の前記前記第1の床の下側の第2室の気圧より高くし、且つ、それら2つの室内空間の気圧を共に前記筐体の外部より高くすることにより、第1室内で安定した清浄度を保つ事ができる。ここで第2室は、筐体外より少なくとも0.1Paは保つことが好ましい。

ファンフィルタユニットからの清浄空気の風量は、前記筺体内の前記第 1室での換気回数が、1分間当り5回以上45回以下であるであることが 好ましい。換気回数が1分間当り5回未満では、異物が筺体内に逆流し清 浄度が保てない。換気回数が1分間当り20回程度あれば、内部の搬送ロ ボットが運動していても充分清浄度が保てるが、ウエハ出入ドアが開放し たまま停止する事故など、非常状態に対処するために、換気回数が45回 まであることが好ましい。換気回数が45回を越えると、第1室内での空 気の流速が早くなりすぎ、搬送ロボットのアームの下に渦流が発生して、 かえって異物を巻き込みながら空気を滞留させて好ましくない。

前述の範囲の換気回数を実現するために、ファンフィルタユニットの清 浄空気吹出速度を制御する。風速が 0.1 m/秒未満であると風量不足で 換気回数 5 回/分を達成する事が出来ず、本発明の特徴であるドア周辺の 隙間から、外部の異物粒子が拡散侵入して粒子数は異常に多くなり、クリーン移載機としては致命傷となる。逆に風速が高すぎると静電気が発生し、半導体回路を切断したり液晶ガラス基板上のトランジスタ回路を破壊したりする等、好ましくない。また、高い風速には高い送風圧力が必要となり、空気を濾過してフィルタに貯まった異物粒子がその圧力で押し出されて、清浄空間である第1室を汚す恐れが出てくる。本発明において用いるULPAフィルタは0.65m/秒を超えると前述した恐れがあり、この値が上限となる。

次に、本発明の移載装置では、前記ドアを上下に移動させるとともに、その移動のために前記第1の床の下側の第2室側に設けるドア通路を隔壁で覆う事が好ましい。かくして、第1室内から第2室に流入する清浄空気が、前記通路を経て直接筐体外の排出され、ドアの汚染が防止される。また、前記ドアは、FOUP (Front Opening Unified Pod)等のウエハ用カセットの前部の蓋を、そのドアに吸着固定してそのドアと一緒に昇降移動させるものでも良い。

ここで、前記ドアと、前記ドア通路と、前記カセットを前記ドアに対して前後に移動させる台とを具えた装置をロードポートと呼ぶが、本発明の移載装置の壁に、かかるロードポートを1または2以上組み込むこともできる。

さらに、前記第1の床を設け、前記第1室の換気回数を1分間当り10回以上で45回以下に保てば、故障などによる前記ロードポートの交換作業の際に、前記第1室内の清浄度を高く維持しつつ、ロードポートを一台取り外すこともできる。ロードポートを一台取り外すと、筐体の一方の壁の全体の面積の10%から20%程度、第1室については上記一方の壁のその第1室の壁面積の10%から20%程度の開口が形成されるが、本願発明者は、第1室の気圧と外部の気圧との差圧が0.1Pa以上あれば、0.

1 μm以上の異物粒子を1個/1立方フィート以下に保つことができる ということを見いだした。

さらに本発明では、異物の侵入と有機物などによる汚染とを防止する前述のような移載装置を利用した薄板状電子部品製造設備をも提供する。本設備は、前記移載装置を介在させて、薄板状電子部品を収納して搬送するカセットのためのカセットステーションと、レジストコータ、プリベーク、露光、現像、ポストベーク、エッチング、洗浄等各種処理を行う処理チャンバとを繋いだ設備である。

本発明にいう空気の流通が可能な床とは、多孔ステンレス板、多孔プラスチック板、複数の矩形または短冊状の穴の開いた格子状体等かたなる床を言う。第1の床の開口率は筐体の床面積の5%以上で50%以下程度が好ましい。5%未満では、清浄室内で発生した異物を室外に排出する機会が少なく好ましくない。また、逆に50%を越えると、室外から異物の巻き込みが発生しやすく好ましくない。

筐体底部の開口率は、前述の第1の床の開口率より大きいことが好ましい。これによって第1室の気圧が第2室の気圧より高く保持され、クリーン度が高く保持できる。即ち、外部への筐体底部の開口率は、第2の床を設けること等によって筐体の床面積の5%以上で70%以下の範囲で調整される。

安定したクリーン環境を維持するには、開口率が、第1の床は5%以上で30%以下、筐体底部は10%以上で60%以下の範囲内であることがさらに好ましい。

本発明にいう筐体は、外界から隔離し内部を清浄に保つために重要な部材であって、ステンレス製、アルミニウム製、帯電防止型プラスチック製等の材料を用いて製作される。この筐体内には第1の床によって、ウエハなど薄板状電子部品が搬送ロボットのアームにより搬送される第1室と、

搬送ロボットの本体下部と制御装置、その他の機器が収納される第2室とが画成される。なお、グレーチング板等からなる第2の床を特に設けなくとも、筐体底部上にこれら機器を分散して配置し、その結果、外部への筐体底部の開口率が5%以上で70%以下となってもよい。

本発明にいう搬送ロボットは、ウエハなど薄板状電子部品をそのフィン ガー上に載置または吸着して搬送し、カセットから各種処理チャンバへ移 載する機械であり、1アームまたは2アームのスカラ型ロボットや、多関 節型ロポット等であって、クリーンルーム仕様の搬送機である。この搬送 ロボットのアームの関節部には、ベアリング付近のカバー隙間に磁石リン グで磁性流体を止める磁性流体シールを設けて、アーム内のベルトやプー リやギヤからアーム外への発塵を遮断する。またこの搬送ロボットのアー ムの昇降のために、この搬送ロボットの胴体が上下運動(以下「Z軸移動」 という)をすると、その胴体内の空気が出入りするが、その空気をここで は、ロボット底部に設けた通気口としての開口部から吸排気させるか、ま たは胴体の側面に胴体を覆う胴体カバーを取り付け、加えてその胴体カバ ーの内側に隙間をあけて、ロボット基台を覆う基台カバーを取り付け、ロ ボットの側面下部の通気口としてのその下向きのカバー隙間から上方向 に吸気し、下方向に排気する構造とすることが好ましい。このようにすれ ば、ロボット下部に排気ファンを設けなくても、ロボットの胴体内の異物 粒子を含んだ空気をロボットの下部から下方に排出することができる。な お、第1の床の開口率をある程度低く抑えるために、搬送ロボットの本体 (胴体) は、左右に移動(以下X軸移動という) せず回転するのみの方が 望ましい。

図面の簡単な説明

図1は、本発明の一実施形態の薄板状電子部品クリーン移載装置を具え

G.

る薄板状電子部品製造設備を示す一部切欠き斜視図である。

図2は、本発明の他の一実施形態の薄板状電子部品クリーン移載装置を示す一部切欠き斜視図である。

図3は、図2に示すクリーン移載装置における、カセットを載置するロードポートを示す斜視図である。

発明を実施するための最良の形態

図1は、本発明の一実施形態としてのクリーン移載装置を具える薄板状 電子部品製造設備を示す一部切欠き斜視図であり、図中符号1はその薄板 状電子部品製造設備、2は本発明の一実施形態としてのクリーン移載装置 2 をそれぞれ示す。この実施例のクリーン移載装置 2 は、筐体 2 a の天井 にシロッコファンからなる送風機4とULPAフィルタ(例えばダイキン ニューロファイン(ボロンフリータイプ)LMH6051050型)5と 清浄空気吹出口6とからなるファンフィルタユニット3を具えるととも に、

筺体2aの一方の壁に

半導体ウエハを収納するカセット7を

載置した ロードポート20を具え、反対側の壁にはロードロック室32のドア33 を具えており、他の壁は全て外部に対し気密にしている。そして筐体 2 a の内部には、ウエハ15を搬送する、シングルアームのスカラ型ロボット である搬送ロボット10と、その搬送ロボット10のアーム17のすぐ下 に位置する第1の床11と、筺体2aの下部にあって筺体2aの底部フレ ーム2b上に位置する第2の床13とを具えている。ここにおける清浄空 気吹き出し口6と第1の床11と第2の床13とは共に磨きステンレス スチール製のパンチングメタル板を使用し、筺体2aの壁材と柱はアルミ ニウム製である。

さらに、この実施形態のクリーン移載装置 2 は、筐体 2 a の内部にウエハ位置決め装置 1 4 とロボット用の制御装置 1 2 とを具えるとともに筐

体2aの外部に制御用データの入出力装置16を具えており、搬送ロボット10とウエハ位置決め装置14とロボット用の制御装置12とは上記 筐体2aの、外部に対し空気流通可能な開口部を持つ底部フレーム2b上 に設置されている。またこのクリーン移載装置2は、ロードロック室32のドア33を介して外部に対し気密に半導体処理装置30と接続しており、この半導体処理装置30では、ロードロック室32と各種の処理チャンバー34との間を、処理装置用搬送機31がウエハを搬送している。

図2は、本発明の他の一実施形態としてのクリーン移載装置を示す一部 切欠き斜視図である。この実施形態のクリーン移載装置2では、筐体2 a の天井に先の実施形態と同様のファンフィルタユニット3を具え、カセット7用のドア21は2つあってそれぞれ上下にスライドし、そのスライド 通路はそれぞれ隔壁19で第2室の他の部分から隔離され、第1の床11は、搬送ロボット10の中位部でアーム17のすぐ下に水平に配置したステンレススチール製パンチング板で作られている。搬送ロボット10は、所謂ダブルアームのスカラ型ロボットで、第1の床を貫いて、電源装置18、制御装置12と共に筐体2aの、外部に対し空気流通可能な底部フレーム2b上に設置されている。第2の床13は短冊状の複数枚のパンチング板で構成されて、上記底部フレーム2b上に必要に応じて取り外し可能に固定されている。

図3は、図2に示すドア21を持つロードポート20を移載装置2の外側から見た図である。壁24内に設けられたドア枠23とドア21との間には隙間Lが設けられ、この実施例では隙間Lの大きさ(幅)は2mmに設定されて、清浄空気が移載装置2の筐体2aの内側から外側へ流れ出る様にしてある。尚、図2中の第1の床11と搬送ロボット10の胴体との間にも同様に隙間が設けられ、その隙間の大きさ(幅)は5mmである。ドア21は、壁24の向こう側、即ち移載装置2の筐体2aの内側を図3

9 5 -

に示す位置から下方へ垂直に下りて開く。ウエハを収納したカセットは、ステージ22上に載置されドア21の開閉に従って前後に移動し、この移動中のカセット前端外縁とドア枠23との間の隙間の大きさ(幅)は、最大でも25mmに抑えられる。

なお、ここにおける搬送ロボット4のアーム関節部26には、ベアリング付近のカバー隙間に磁石リングで磁性流体を止める磁性流体シールを設けて、アーム内のベルトやプーリやギヤからアーム外への発塵を遮断している。また、この搬送ロボット4のアーム17の昇降のために、この搬送ロボット4の胴体が上下に2軸移動をすると、その胴体内の空気が出入りするが、その空気をここでは、胴体の側面に胴体を覆う胴体カバー27を取り付け、加えてその胴体カバー27の内側に隙間をあけて、ロボット基台を覆う基台カバー28を取り付け、ロボットの側面下部の通気口としてのその下向きのカバー隙間から上方向に吸気し、下方向に排気する構造としている。

(実施例)

以下、本発明の実施例について説明する。

〔実験装置〕

図 2 に示すクリーン移載装置(ローツェ(株)製RACS 3 0 0 -2 A型) 2 を用いて清浄度の計測実験を行った。天井部に設けたファンフィルタユニット 3 は、シロッコファン4を 2 基並列に搭載し、ULPAフィルタ 5 は 0 . 1 μ m シリカ粒子を 9 9 . 9 9 9 9 %除去する性能があり、第1室への吹出部は直径 5 m m の穴を多数開けたパンチングメタル板製天井6 のほぼ全面で面積 5 9 0 m m × 1 0 8 0 m m 、最大風速は吹出部の下2 0 0 m m 位置で 0 . 6 5 m / 秒である。第1室の容積は横 1 1 5 0 m m × 奥行き 6 8 5 m m × 高さ 6 0 5 m m である。第1の床 1 1 を貫いて、胴

体直径260mmのスカラ型の搬送ロボット(ローツェ(株)製RR713型)10を第2室の底部中央の底部フレーム2b上に据え付けてある。第1の床11は、直径4mmの穴を多数開けたパンチングメタル板製で、搬送ロボット10の周辺に0.5mm幅の隙間をあけて、搬送ロボット10が上下及び回転運動できる様にした。

横方向の一方の壁面には、300mmウエハ収納カセット(以後「FOUP」と言う)を置くロードポート20を2台設置し、そのポートドアを前記壁面のドア21とした。ドア面積は360mm×335mmで、その周囲にはドア閉時6mm幅の隙間が設けてあり、ドア21が開きFOUPが壁厚み分前進する際、一時的に最大20mm幅の隙間ができるが、停止するとFOUPとドア枠23との間の隙間は6mm幅に収まる。その他の周囲の壁面は密閉とした。

底部フレーム2 bは、ロボット台や制御機器等の機器を設置して、パンチングメタル板の第2の床13を用いない場合が開口率最大で53%であり、その底部フレーム2 bの、外部への開放部分にパンチングメタル板を並べて、底部フレーム2 bの開口率を変化させた。また、本実験では、第1の床11と第2の床13の開口率は、パンチングメタル製の床に板幅40mmのプラスチックテープを貼って変化させた。

〔測定〕

風速は、第1室のほぼ中央部天井から200mm下の位置で、リオン (株) 製風速計AM-09S型を用いて測定した。差圧は、天井から約600mm下で奥行き側壁の中央部から約300mm内側で測定した。異物粒子は、パーティクルカウンター、日立電子エンジニアリング(株) 製レーザダストモニターTS3700を用い、0.1 μ m以上の粒子について、28.3L/分(=1Cubic Feet/min.)でエアを1分間吸引してデータを取り、3回測定して平均した。搬送ロボット10でウエハを移送しながら

測定する場合は、サンプリング点として、天井下ほぼ450mmの高さでアーム17に接触せずなるべく中央に近い場所を選んだ。また、ウエハ下でのサンプリングは、第1室内で300mmウエハを搬送ロボット10のアーム17の先端部のフィンガー上に乗せたまま停止し、その直下でサンプリングした。

〔実施例1〕

第1の床11として、4mm φ孔が1辺8mmの正三角形の各頂点に開けられたパンチング板(多孔板)を用い、その開口率は、搬送ロボット10の胴体周縁の5mm幅の隙間と、ドア21の周辺の6mm幅の隙間と、ドア21の昇降通路部分とのすべての開口部を合算して20%であった。底部フレーム2b上には、搬送ロボット10、電源装置18、制御装置12等を設置し、パンチング板の第2の床13は特に置かず、その底部フレーム2bの開口率は53%となった。

ファンフィルタユニット 3 からの吹き出し速度を、0.05m/秒から 0.65m/秒まで変化させ、搬送ロボット 1.0 を運転してウエハを 2 つの FOUP間で移し変えしながらウエハのすぐ上で、またウエハを搬送ロボット 1.0 のフィンガー上に載置したまま停止したウエハのすぐ下で、それぞれ清浄空気をサンプリングし、 0.1μ m以上の異物粒子数を計測して、表 1 に記入した。

第1室内と外部との差圧、第2室内と外部との差圧は、前記風速を変化させるたびに測定し、同じく表1に記入した。換気回数は第1室の容積で吹き出し風量を除して算出した。

表1に記された結果から、ウエハの上で、0.1 m/秒 (換気回数6.4回/分) 以上では異物粒子数は0で全く問題がない。一方、ウエハの下では、0.3 m/秒 (換気回数19.1回/分) では問題ないが、0.1 m/秒、0.5 m/秒、0.6 m/秒 (換気回数38.3回/分) では0.

3個で、この範囲ではクラス1が満たされている。

〔実施例2〕

実施例1において、底部フレーム2bの一部に第2の床13としてパンチング板を敷いて底部フレーム2bの開口率を25%とした他は同様にし、結果は表1に纏めて示した。0.65m/秒の風速、ウエハ直下で0.3個が見られるのみで、他は全く問題ない。換気回数4.8回/分以下では換気不充分であるが、41.5回/分まではクラス1が保たれ、第2の床の効果がある事が分った。

〔実施例3〕

実施例2において、第1の床の開口率を5%に絞った他は同様にし、結果は表1に纏めて示した。0.6m/秒の風速でウエハ直下で0.3個、0.65m/秒の風速で(換気回数41.5回)ウエハ直下で2.3個が見られるが、他は問題ない。即ち、0.1m/秒から0.6m/秒の範囲ではクラス1が満たされている。

〔実施例4〕

実施例1において、底部フレーム2bの一部に第2の床13としてパンチング板を敷いて底部フレーム2bの開口率を12%とした他は同様にし、結果は表1に纏めて示した。0.1m/秒から0.65m/秒の範囲、換気回数6.4回/分からで換気回数41.5回の範囲クラス1が満たされ、さらに高い換気回数でも良好である事を示唆している。

〔実施例5〕

実施例4において、幅470mm、高さ1577mmのロードポートを1台外し、筐体2aのロードポート側の壁に第1室と第2室とに亘って開口率12.7%の開口部を設けた。上記壁の、第1室に面する部分に対するこの開口部の開口率は13%であった。異物粒子数および差圧のデータは表1に纏めて示した。この結果、換気回数12.8~41,5回/分の

Ú,

範囲で、第1室の差圧が 0. 1 Pa 以上に保たれれば、第2室の差圧が 0. 1 Pa を下回っても、ウエハ下部での異物粒子は全て1未満となり、クラス 1 が達成されていることが判明した。従って、本実施形態のクリーン移載 装置のロードポート 2 0 が故障しても、ファンフィルタユニット 3 を止めずにロードポート 2 0 の交換作業を行えば、全く汚染させることなく、且 つ、クリーン移載装置の運転を止めることなく、または短時間の停止で、その故障に対処し得ることが判明した。

〔表1〕

		FFU風速m/秒	0.05	0.075	0.1	0.3	0.5	9.0	0.65	響	掀
1	(難口解)	換気回数/分	3.2	4.8	6.4	19.1	31.9	38.3	41.5		
実施例1	第1压/20%	ウエハ上・粒子数/CF	640	370	0	0	0	0	0	ウエハ移戯中	8載中
	匯体底部/53%	4	3,200	1,500	0.3	0.0	0.3	0.3	1.3	1	1
		差圧(第1室)	0.06	0.15	0.34	2.7	8.2	12.2	16		
		\neg	0	0.05	0.2	1.16	2.9	3.5	4.1		_
	1	FFU風速m/秒	0.05	0.075	0.1	0.25	0.5	9.0	0.65		
1	(換気回数/分	3.2	4.8	6.4	16	31.9	38.3	41.5		
実施例2	第1床/20%	上·粒子数/CF	1,870	1,660	0	0	0	0	0	ウエハ移戯中	5載中
	匿体底部/25%	下·粒子数/CF	4,420	1,140	0	0	0	0	0.3		停止
		差圧(第1室)	0	90.0	0.29	1.8	9.5	11.6	12.9		
		差圧(第2室)	0	0.05	0.2	4.0	2.8	4.5	5.1		
		FFU風速m/秒	0.05	0.075	0.1	0.25	0.5	9.0	0.65		
1	(瀬口藤)	換気回数/分	3.2	4.8	6.4	16	31.9	38.3	41.5		
美施例3	第1床/5%	上·粒子数/CF	3,800	3,170	0	0	0	0	0	ウエ	//移載中
	置体底部/25%	下·粒子数/CF	1,170	4,300	0	0	0	0.3	2.3	アーム係	停止
		差圧(第1室)	0	0.07	0.43	2.96	16.6	21.4	23.8		
		(第2室)	0	0	0.17	9.0	2.5	4	4.4		
	; ;	FFU風速m/秒	0.05	0.075	0.1	0.3	0.5	9.0	0.65		
1	(瀬口海)	γ	3.2	4.8	6.4	19.1	31.9	38.3	41.5		
美施例4	実施例4 第1 床/20%	\backslash	3,800	1,500	0	0	0	0	0	ウエハ移載中	。載中
	庫体底部/12%	下·粒子数/CF	2,100	1,100	0	0	0	0	0	アーム停止	ᅼ
		差圧(第1室)	90.0	0.21	0.56	4.4	14.4	19.5	25.6		
		(第2室)	0	0.12	0.39	3.34	10.6	13.5	16.8		
	(第口海)	FFU風速m/秒	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	9.0	0.65		
	第1床/20%	換気回数/分	3.2	6.4	12.8	19.1	31.9	38.3	41.5		
実施例5	置体底部/53%	子数/	3,800	980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ウエハ粉	/移戲中
	壁開口/12.7%	下·粒子数/CF	3,100	1,356	0.7	0.3	0.0	0.0		_	
	(第1室壁開口/13%)	田	0	0.02	0.12	0.21	0.4	0.5	9.0		<u> </u>
		差圧(第2室)	0	0	0	0.02	0.03	0.04	0.05		

産業上の利用可能性

この発明に基づき、クリーン移載装置の中位部にあって搬送ロボットのアームのすぐ下に、空気の流通する第1の床を設けることにより、筐体底部に特に空気流通を制御するパンチング板等の第2の床を設けなくとも、換気回数 $5\sim3$ 8回/分の範囲では少なくとも0. 1 μ m異物粒子に対しクラス1を保てる事がわかった。これは従来のクリーンプースの清浄度を10倍以上上回るものである。ここで、筐体底部に一部でも第2の床としてパンチング板を用いると、空気の渦流が生起するウエハ裏側でも、異物粒子の個を実現でき、第1の床と筐体底部との開口率を所定の条件を満たすものとすることで、換気回数 $5\sim4$ 2回/分以上、0. $1\sim0$. 65 m/秒以上の風速ですべてのデータが00個となり、0. 1 μ m異物粒子に対しクラス00が実現でき、0. 1 μ m線幅の半導体製造が可能となった。また、壁の開口率および外部に対する第1室の差圧を所定の条件を満たすものとすることで、ウエハが全く汚染されることなくロードポートの交換作業を行うことも可能となった。

請求の範囲

1. 筐体内に開口するカセット内に収納された薄板状電子部品を、その筐体内にて、その筐体の天井に設けられたファンフィルタユニットからその筐体内に吹き出す清浄空気下で、その筐体内の搬送ロボットによって所定位置間で自動的に移載する装置において、

前記ファンフィルタユニットが、 $0.1 \mu m$ 以上の粒子を99.99

前記筺体が、前記搬送ロボットの中位部にてその搬送ロボットのアームの下側に水平に配置された空気流通可能な第1の床を具え、前記ファンフィルタユニットとその第1の床との間に第1室を画成するとともに、外部に対し空気流通可能な筐体底部とその第1の床との間に第2室を画成することを特徴とする、薄板状電子部品クリーン移載装置。

- 2. 前記第1室の壁が、上下に移動するドアを具え、 前記ドアのための、前記第2室側にあるドア通路が隔壁で覆われ、 前記第1室から前記第2室に流入する清浄空気が、前記ドア通路を経 て直接前記筐体底部に排出されることを特徴とする、請求項1記載の薄 板状電子部品クリーン移載装置。
- 3. 前記第1室の壁に設けられたドア枠部とこれに隣接して設置される前記ドアとの間および/または前記ドア枠部とカセットとの間並びに、前記第1の床と前記搬送ロボットの胴体との間に、幅1mm以上30mm以下の隙間を設けることを特徴とする、請求項1または2記載の薄板状電子部品クリーン移載装置。
- 4. 前記搬送ロボットが、

前記アームの関節部に設けられた発塵防止シール構造と、

前記アームを支持する胴体の降下作動に伴ってその胴体内の空気を 下向きに排出する通気口と、

を具えることを特徴とする、請求項1から3までの何れか記載の薄板状電子部品クリーン移載装置。

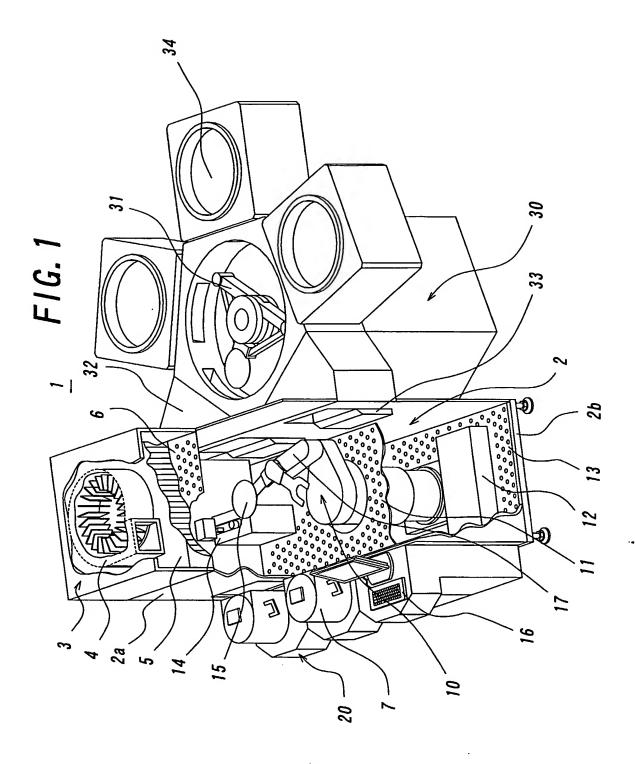
- 5. 前記筐体が、前記搬送ロボットの基台付近に水平に配置されて外部に 対する前記筐体底部の開口率を変化させる空気流通可能な第2の床を 具えることを特徴とする、請求項1から4までの何れか記載の薄板状電 子部品クリーン移載装置。
- 6. 前記第1の床の開口率が5%以上で50%以下であり、且つ、前記筐体底部の開口率が5%以上で70%以下であることを特徴とする、請求項1から5までの何れか記載の薄板状電子部品クリーン移載装置。
- 7. 前記第1室の内圧が前記第2室の内圧より高く、 前記第2室の内圧が0.1Pa以上であることを特徴とする、請求項1 から6までの何れか記載の薄板状電子部品クリーン移載装置。
- 8. 前記第1室の換気回数が1分間当り5回以上45回以下であることを 特徴とする、請求項1から7までの何れか記載の薄板状電子部品クリー ン移載装置。
- 9. 前記ファンフィルタユニットから前記第1室への前記清浄空気の吹出速度が0.1m/秒以上で0.65m/秒以下であることを特徴とする、請求項1から8までの何れか記載の薄板状電子部品クリーン移載装置。
- 10. 前記筐体の一方の壁に前記第1室および前記第2室の少なくとも一方に開口する開口部を持ち、

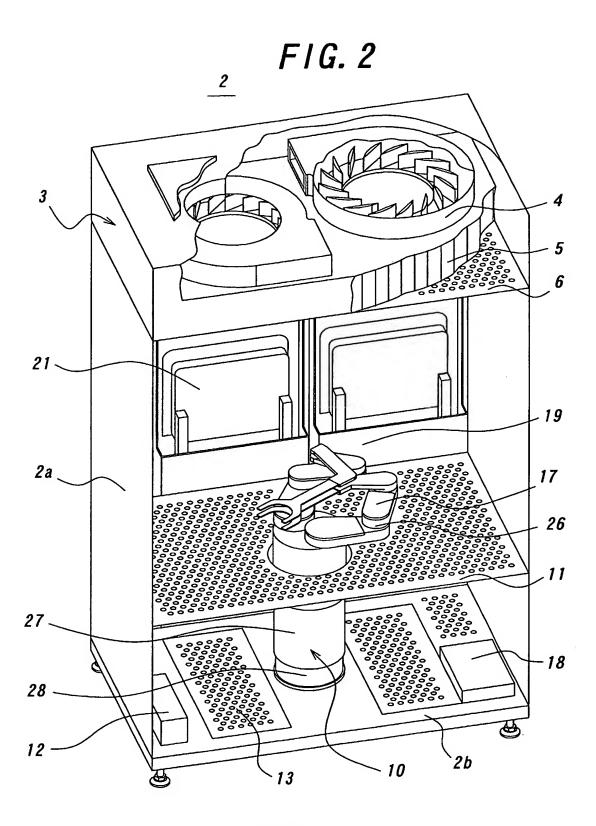
前記一方の壁に対する前記開口部の開口率が20%以下であって、 前記第1室の内圧が0.1Pa以上であり、

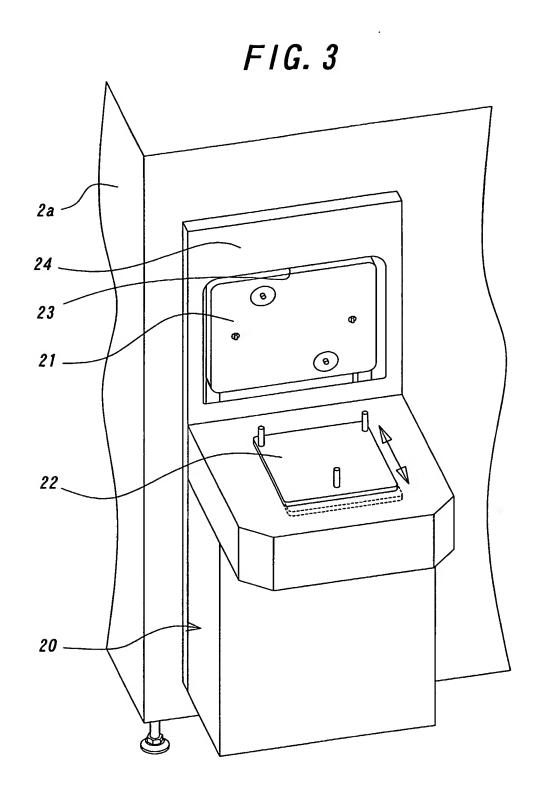
前記第1室の換気回数が1分間当り10回以上45回以下であることを特徴とする、請求項1から9までの何れか記載の薄板状電子部品ク

- リーン移載装置。
- 11. 請求項1から10までの何れか記載の薄板状電子部品クリーン移載装置を具えることを特徴とする、薄板状電子製品製造システム。

ŷ'









International application No.
PCT/JP03/07075

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ F24F7/06, H01L21/02							
According	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELD	S SEARCHED						
Minimum o	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ F24F7/06, H01L21/02						
Jits	tion searched other than minimum documentation to the uyo Shinan Koho 1926-1996 i Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003	Jitsuyo Shinan Toroku Koh	o 1996–2003				
Electronic o	Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)						
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT							
Category*	Citation of document, with indication, where a	ppropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
Y	JP 9-298136 A (Nissin Electron 18 November, 1997 (18.11.97) (Family: none)		1-3,6-11				
Y	JP 2001-182978 A (Hitachi Pu & Hitachi, Ltd.), 06 July, 2001 (06.07.01), (Family: none)	1-3,6-11					
Y	JP 2000-357641 A (Hitachi Pu & Hitachi, Ltd.), 26 December, 2000 (26.12.00) (Family: none)	ranto Kabushiki Kaisha ,	1-3,6-11				
		·					
Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.					
"A" docume conside "E" earlier date "L" docume cited to special "O" docume means "P" docume	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not red to be of particular relevance document but published on or after the international filing ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other ent published prior to the international filing date but later e priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family					
Date of the actual completion of the international search 29 July, 2003 (29.07.03) Date of mailing of the international search report 12 August, 2003 (12.08.03)							
	ailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer					
Facsimile No.		Telephone No.					

電話番号 03-3581-1101 内線 3375

	国際調査報告	国際出願番号	PCT/JP03	3/07075		
	属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Cl' F24F7/06, H01L21/0	2				
B. 調査を行	テった分野					
	设小限資料(国際特許分類(IPC))	-				
Int.	Int. Cl' F24F7/06, H01L21/02					
日本国第 日本国纪 日本国第	最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996 日本国公開実用新案公報 1971-2003 日本国実用新案登録公報 1996-2003 日本国登録実用新案公報 1994-2003					
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)						
	ると認められる文献		.,	BB/士		
引用文献の カテゴリー*	 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	・きは、その関連する領	第所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
Y Y	JP 9-298136 A (日新聞) 1.18 (ファミリーなし)			1-3, 6-11		
Y	JP 2001-182978 A			1-3, 6-11		
Y	会社日立製作所), 2001.07. JP 2000-357641 A 会社日立製作所), 2000.12.	06 (ファミリー) (日立プラント株式	ーなし) 式会社&株式	1-3, 6-11		
□ C欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。						
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表された文献であって、出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理師の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発師の表しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「B」同一パテントファミリー文献				発明の原理又は理論 当該文献のみで発明 さられるもの 当該文献と他の1以 当明である組合せに		
国際調査を完	了した日 29.07.03	国際調査報告の発送	12.0	8.03		
日本	の名称及びあて先 国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915	特許庁審査官 (権限の 千馬 隆	4	3M 8009		
1 -	HYM AIOO OAIO					

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号